

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИФРАКТОМЕТР

MAXima-X XRD-7000

ДЛЯ

Качественного анализа
Количественного анализа
Анализа состояния вещества
Рентгеноструктурного анализа
Программной обработки дифрактограмм



Вертикальный θ - θ гониометр

Области применения

- Керамика, огнеупоры
- Строительные материалы
- Объекты окружающей среды, отходы
- Чёрные металлы
- Химикаты, катализаторы
- Цветные, благородные металлы
- Материалы электроники
- Машиностроение, автомобили, судостроение
- Фармацевтические препараты
- Природные ресурсы (уголь, торф, руды, минералы)

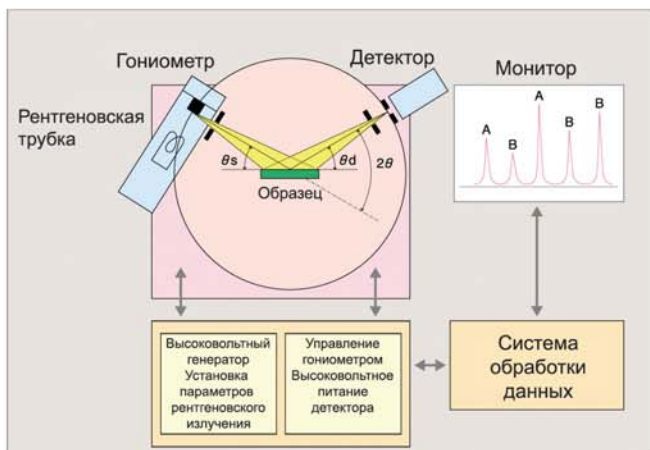
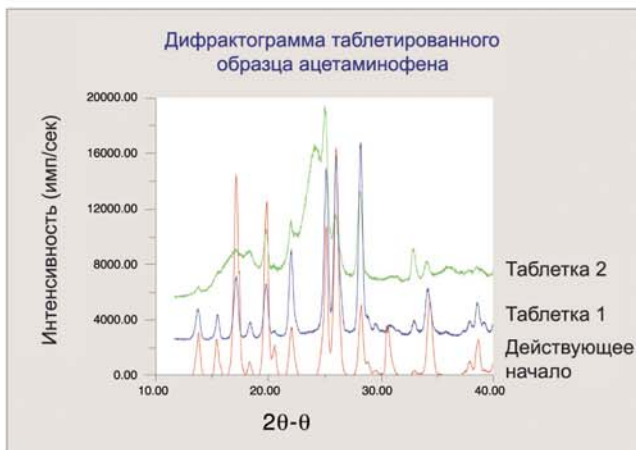


Схема XRD-7000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позиция	Наименование	Характеристики
Рентгеновская трубка	Материал и тип анода	Cu, Co, Fe, Cr,
	Размеры фокуса и максимальная мощность	1,0 x 10 мм; максимальная мощность 2 кВт 2,0 x 12 мм; максимальная мощность 2,7 кВт 0,4 x 12 мм; максимальная мощность 2,2 кВт
	Максимальная мощность	3 кВт
Рентгеновский генератор	Максимальные параметры работы	60 кВ – 80 мА
	Защита трубки	Защита от превышения мощности, перегрузок по току и напряжению, перебоев водоснабжения
	Механизмы защиты	Механизм блокировки двери Аварийный стоп
Гониометр	Тип	Вертикальный $\theta - \theta$
	Радиус гониометра	275 мм (XRD-7000L), 200 мм (XRD-7000S) Может изменяться от 200 до 275 мм
	Размеры образца максимальные	400 мм x 550 мм x 400 мм
	Автосамплер	5 позиций (опция)
	Минимальный шаг сканирования	0,0002° (2θ); 0,0001° (θ)
	Режимы работы	Непрерывное сканирование, пошаговое сканирование, позиционирование, осцилляция по оси θ
	Скорость сканирования	0,1° ~ 50°/мин (θ_s, θ_d); 0,1° ~ 100°/мин (2θ)
Дополнительные принадлежности (опции)	Система поликапиллярной оптики	
	Система автоматических переменных щелей	
	Монохроматор дифрагированного пучка	
	Приставка для вращения образца	
	Приставка для анализа тонких плёнок	
	Приставка для анализа волокон с программным обеспечением	
	Приставка для анализа микрообъектов с цифровой видеокамерой	
	Приставка для анализа макронапряжений с программным обеспечением	
Дополнительное программное обеспечение (опции)	Высоко- и низкотемпературные камеры	
	Приставка для текстурного анализа с программным обеспечением	
	Расчёт остаточного аустенита	
	Прецизионный расчёт параметров решётки	
	Определение степени ориентации волокон	
	Определение размеров кристаллитов и искажений решётки	
	Определение степени кристалличности	
Базы данных порошковых дифрактограмм <i>PDF-2</i> и <i>PDF-4</i> Анализ <i>Rietveld</i>		



WWW.SHIMADZU.COM

• WWW.SHIMADZU.EU

• WWW.SHIMADZU.RU

Shimadzu Europa GmbH

Albert-Hahn-Str. 6-10, D-47269, Duisburg, Germany
tel: +49 203 76870, fax: +49 203 7687 271

Представительства в России:

Москва

119049, 4-ый Добрынинский пер., 8, БЦ «Добрыня», оф. С13-01
телефон: (495) 989-13-17, факс: (495) 989-13-19
E-mail: smo@shimadzu.ru

Санкт-Петербург

190000, наб.р.Мойки, 58, БЦ «Мариинский», оф. 302
телефон/факс: (812) 325-72-61, 320-86-91
E-mail: spo@shimadzu.ru

Владивосток

690091, ул. Адмирала Фокина, 20, оф. 404, 4 этаж
телефон: (423) 243-12-32, факс: (423) 243-12-23
E-mail: svl@shimadzu.ru

Дистрибьютор Шимадзу 

Екатеринбург

620075, ул. Бажова, 68 т/ф (343) 278-34-64 (-65,-66,-67,-68,-69)
e-mail: ekb@element-msc.ru

Москва

117105, Варшавское ш., 1, стр.6, БЦ «W Plaza 2»
т/ф (495) 514-00-48; e-mail: msc@element-msc.ru

Новосибирск

630007, ул. Октябрьская, 42, оф. 308 т/ф (383) 20-20-726
e-mail: nsk@element-msc.ru

www.element-msc.ru